

XPS 分析事例-2 金属粉末の表面分析

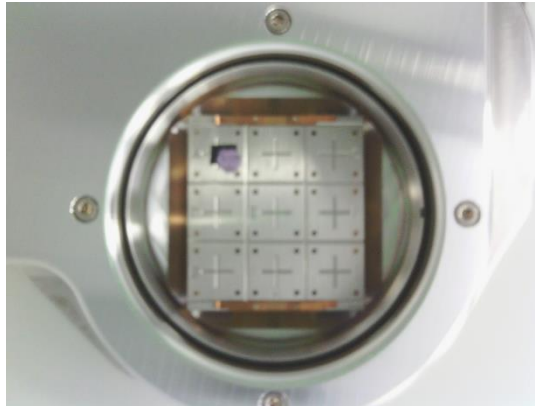


図1 試料の形状

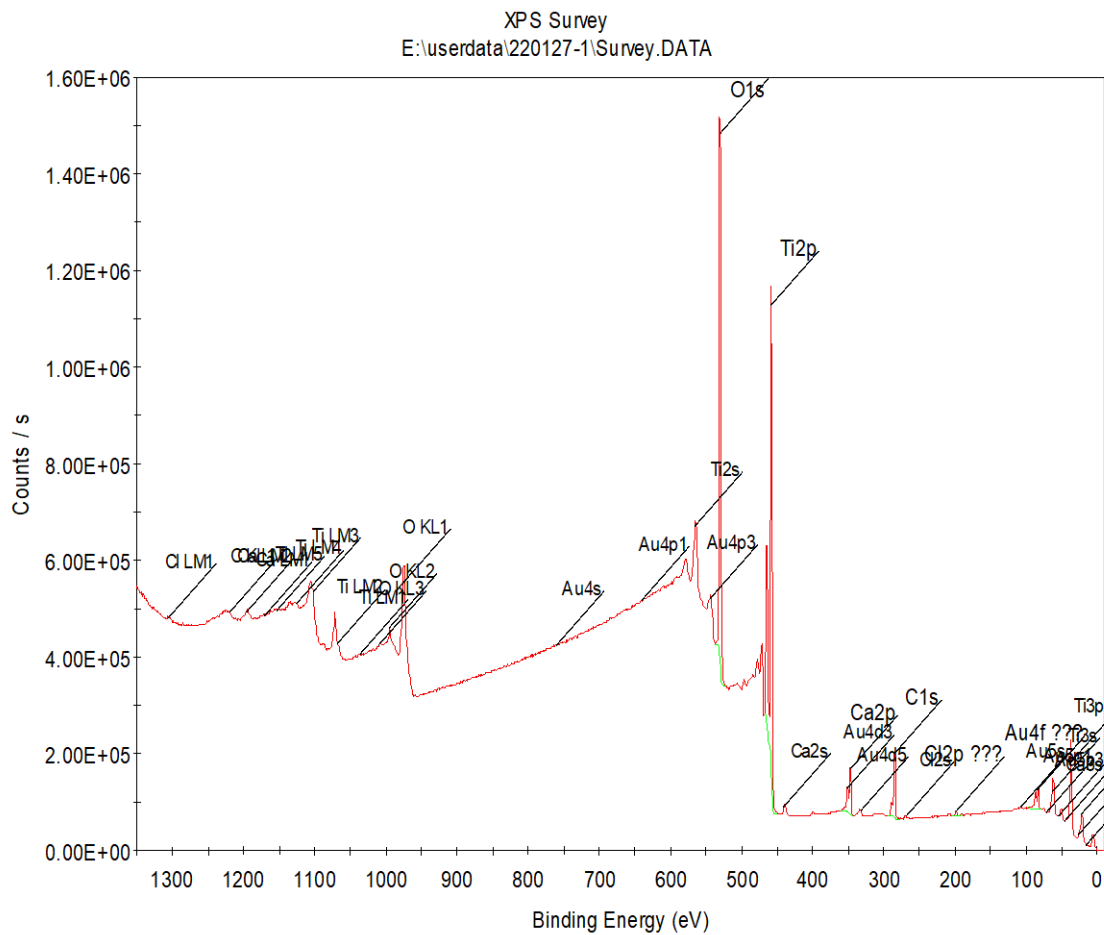


図2 サーベイスキャン結果

ワイドスキャン 5回 約6分

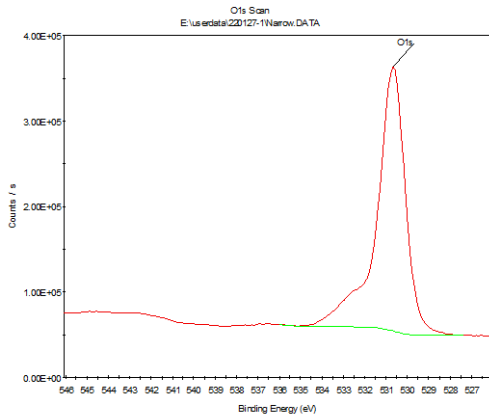
ナローズキャン結果 (パスエネルギー**200eV**, エネルギーステップ**1eV**)

表 1 検出元素一覧

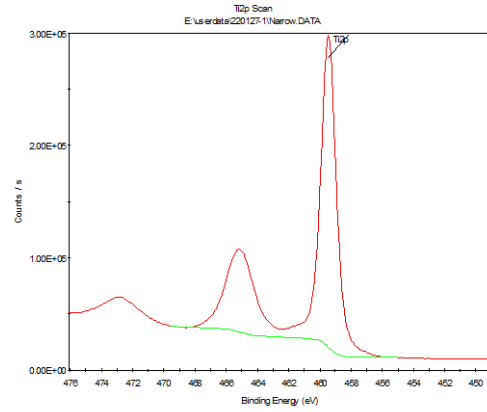
**Elemental ID and Quantification**

Name	Start BE	Peak BE	End BE	Height CPS	FWHM eV	Area (P) CPS.eV	Area (N)	Atomic %
Ti2p	467.58	458.25	449.08	837821.67	2.43	3419801.88	8348.97	23.74
O1s	537.08	529.9	523.08	1027804.05	2.62	3256709.1	18863	53.64
C1s	294.08	284.9	277.58	124375.03	2.71	471975.14	6618.64	18.82
Ca2p	360.08	347.21	342.08	81891.5	2.89	417315.97	1021.08	2.9
Au4f ???	96.08	83.21	77.58	35630.9	2.86	201552.5	120.89	0.34
Cl2p ???	203.58	198.33	189.08	10964.48	3.22	39294.45	190.52	0.54

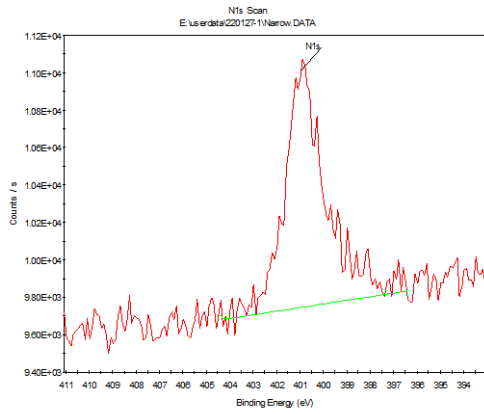
# ナロースキャン結果 (パスエネルギー50eV, エネルギーステップ0.1eV)



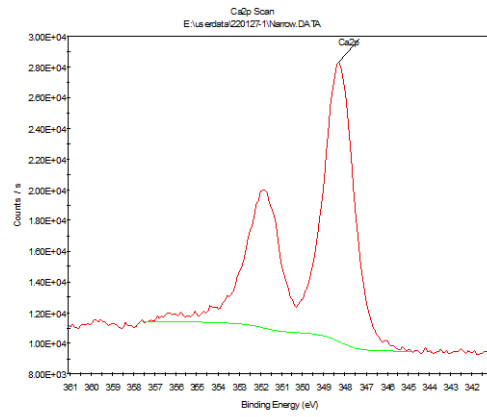
O1s Scan



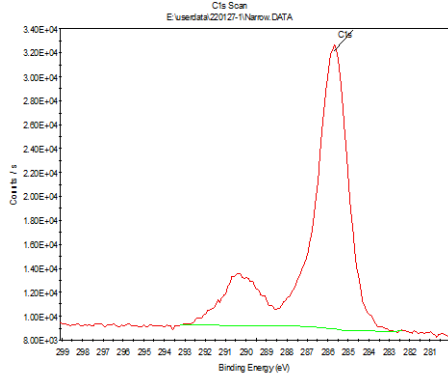
Ti2p Scan



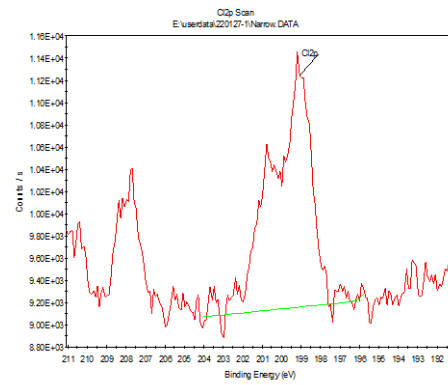
N1s Scan



Ca2p Scan

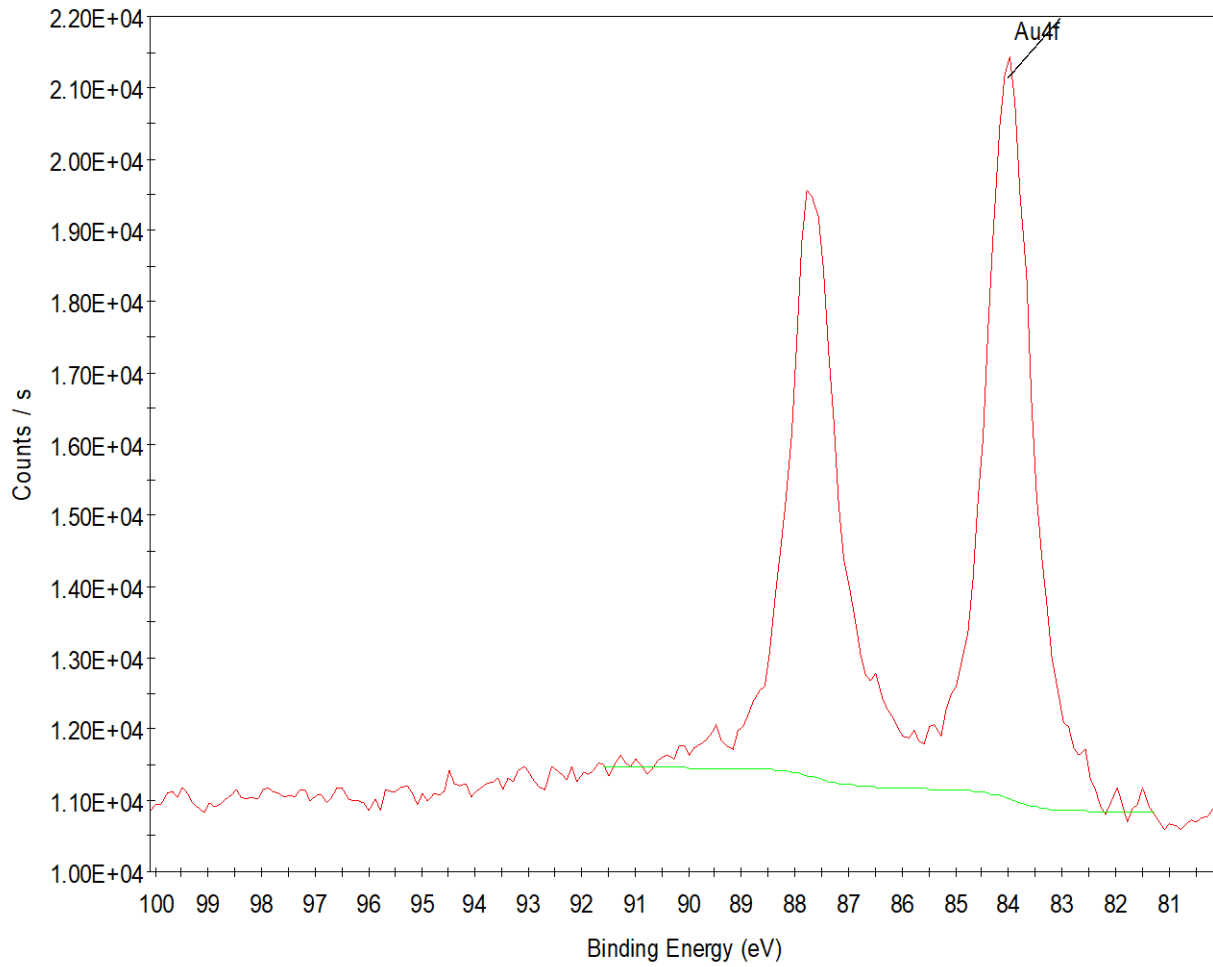


C1s Scan



Cl2p Scan

Au4f Scan  
E:\userdata\220127-1\Narrow.DATA



Au4f Scan

ナロースキャン 各 10 回 1 回につき約 2 分